

開示の要約

膜厚測定に使用されるプリセットスペクトルデータの異常検出方法、 および光学的膜厚測定装置

5

膜厚の光学的測定に用いられる基準強度データ（ベース強度データ）などのプリセットスペクトルデータの異常検出を自動的に実行することができる異常検出方法が開示される。異常検出方法は、ワークピースの研磨前にプリセットスペクトルデータを作成し、プリセットスペクトルデータをオートエンコーダに入力し、オートエンコーダは、複数の正常なプリセットスペクトルデータを含む訓練データを用いて機械学習により構築された学習済みモデルであり、オートエンコーダから出力された出力データと、プリセットスペクトルデータとの差を算定し、差がしきい値よりも大きいときにプリセットスペクトルデータに異常があると判定する。

15 図 9